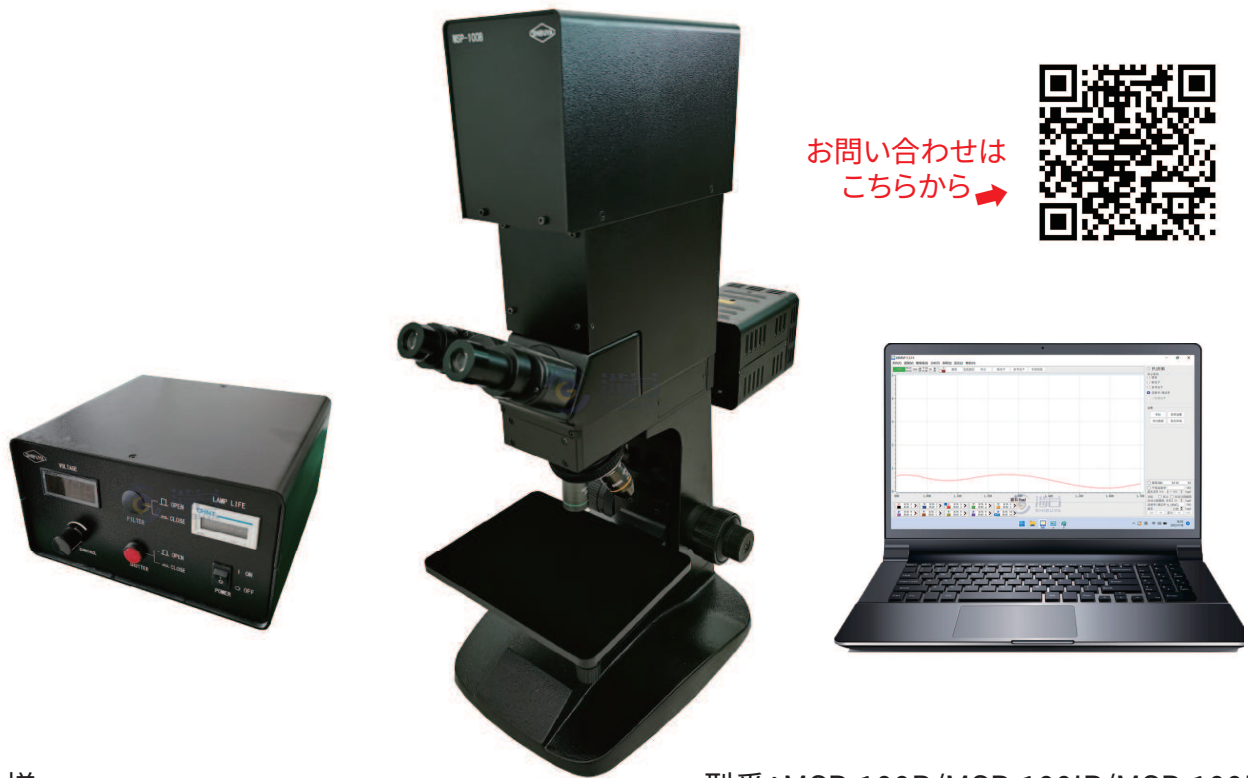


# 反射率測定装置

## MSP-100B/IR/UV



- スポットサイズが小さく、微小点の測定が可能
- 測定時に背面の光が入り込まず、すりガラスや黒塗りによる消光処理が不要
- レンズと平面の両方を測定可能
- 操作が簡単で使いやすく、ソフトウェアのインターフェースもシンプル
- 可視光とUVには背面照射型 CCD センサーを採用し、高い感度と信号対雑音比を実現
- 赤外線には InGaAs センサーを採用し、赤外領域に対する高い感度を持つ



仕様

型番:MSP-100B/MSP-100IR/MSP-100UV

本体ユニット			
測定波長	MSP-100B: 350~1100nm	試料側N.A.	N.A. 0.12 (10×対物レンズ使用時)
	MSP-100IR: 900~1700nm	試料の測定範囲	φ50μm (10×対物レンズ使用時)
	MSP-100UV: 230~800nm	試料の曲率半径	-1R~∞、+1R~∞
測定再現性(B型)	±0.2% (380-450nm)	表示分解能	1nm
	±0.02% (451-950nm)	測定時間	数秒~十数秒 (サンプリング時間により異なる)
	±0.2% (951-1050nm)	外形寸法	(W)230×(H)605×(D)510mm
測定S/N比(B型)	1000:1 (400-900nm)	重量	15KG
電源ユニット			
供給電源	100-240VAC	重量	2.5KG
消費電力	80W	使用温度範囲	18~28℃
出力ランプ電圧	5-10VDC	使用湿度	60%以下 (結露なきこと)
外形寸法	(W)231×(H)130×(D)220mm		

渋谷光学は中国企業とのパートナーシップを活かし  
コストパフォーマンスの高い製品をご提供しています。

株式会社渋谷光学

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3丁目22番2号  
TEL: 048-469-1200 / FAX: 048-469-1311